ОПТИКА И СПЕКТРОСКОПИЯ

УДК 535.417

ОБ ОЦЕНКЕ ОТКЛОНЕНИЙ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК Оптических покрытий при наклонном падении света

Н. В. Гришина, А. В. Тихонравов

(кафедра математики)

Используется статистический подход для оценки влияния ошибок в параметрах слоев двухкомпонентных оптических покрытий на их спектральные характеристики при наклонном падении света.

При реализации на практике многослойного покрытия его параметры — толщины и показатели преломления слоев — всегда несколько отличаются от расчетных, вследствие чего отклоняются от расчетных и его спектральные характеристики (спектры отражения, пропускания и поглощения и фазы волн). В работе [4] был предложен статистический подход к оценке влияния ошибок в параметрах слоев покрытия на спектральные характеристики при нормальном падении света. В настоящей работе этот статистический подход используется применительно к случаю двухкомпонентных покрытий при наклонном падении света.

В основе метода лежат следующие соображения. При наиболее современном способе контроля толщин слоев напыляемых оптических покрытий — контроле по частоте колебаний кварцевого генератора — ошибки в толщинах отдельных слоев независимы, и их естественно считать распределенными по нормальному закону с нулевым математическим ожиданием. Ошибки в показателях преломления слоев определяются случайными отклонениями показателях преломления слоев из одного материала полностью коррелированы. Будем считать их также распределенными по нормальному закону с математическим ожиданием, равным нулю. Пусть число слоев постриляются случайными с математическим ожиданием, равным нулю. Пусть число слоев постриля равно N. Обозиачим ξ_i ($i=1, 2, \ldots, N+2$) — отклонения параметров; $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_N -$ отклонения печетных значений толщин слоев. Пусть $\Delta \Phi(\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_{N+2}, k)$ — соответствующее ошибкам ξ_i отклонение реальной спектральной характеристики от расчетных и четных слоев. Пусть $\Delta \Phi(\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_{N+2}, k)$ — соответствующее ошибкам ξ_i отклонение реальной слектральной характеристики от расчетных и четных слоев. Пусть $\Delta \Phi(\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_{N+2}, k)$ — соответствующее ошибкам ξ_i отклонение реальной спектральной характеристики от расчетной $\Phi(k), k$ — волновое число. По предположению, ξ_i — случайные независимые ошибки, распределенные по нормальному закону, поэтому $\Delta \Phi$ при каждом k — также случайная величина. Обозначим M(k) и D(k) ее первые два момента (они, естественно, зависят от волнового числа k). Эти функции примем за основные характеристики, описывающие степень влияния ошибок в параметрах слоев на спектральные свойства многослойного покрытия.

Считая ошибки в параметрах слоев малыми, порядка нескольких процентов (что соответствует уровню современной напылительной техники), и заменяя величину $\Delta \Phi$ отрезком тейлоровского ряда с точностью до второго порядка малости по ξ_i , получаем явные выражения для M(k) и D(k):

$$M(k) = \sum_{i=1}^{N+2} b_{ii}(k) \sigma_i^2,$$

$$D(k) = \left(\sum_{i=1}^{N+2} a_i^2(k) \sigma_i^2 + 2\sum_{i,j=1}^{N+2} b_{ij}(k) \sigma_i^2 \sigma_j^2\right)^{1/2}.$$

Здесь $\sigma_i = D\xi_i$ — дисперсии случайных величин ξ_i , $a_i = \partial \Phi/\partial d_i$, $b_{ij} = \partial^2 \Phi/\partial d_i \partial d_j$, причем производные вычисляются при расчетных значениях параметров. В качестве интересующих нас спектральных характеристик могут быть коэффициент пропускания или коэффициент отражения (при наличии поглощения в системе один не выражается явно через другой) неполяризованного света или волн s- или p-поляризаций, фазы s- и p-компонент отраженной или прошедшей волн.

Для расчета функций M(k) и D(k) для различных спектральных характеристик были составлены программы на ЭВМ. При задакных дисперсиях σ_i они рассчитывают M(k) и D(k) требуемых спектральных величин в заданном спектральном интервале

для данного покрытия. Кроме того, при необходимости программы выдают на печать вычисленные частные производные (последние могут использоваться для определения слоев системы, наиболее чувствительных к ошибкам параметров) и ряд функций,

таких как $\sum b_{ii}$ и т.п., характеризующих раздельное влияние ошибок в толщинах

 $\begin{bmatrix} t \\ t \\ t \end{bmatrix}$

слоев и показателях преломления на величины M(k) и D(k) [1].

Для сравнения результатов расчета по этим формулам с экспериментальными данными рассмотрим 3-слойное просветляющее покрытие из материалов MgF₂ ($n_1 \simeq \simeq 1,38$), HiO₂($n_2 \simeq 1,98$), Al₂O₃ ($n \simeq 1,65$) на подложке из кварца ($n_l \simeq 1,45$). Первый и третий слои покрытия четвертьволновые, второй — полуволновой на длине волны $\lambda_0 = 0,661$ мкм при нормальном падении света. Измерения и расчет коэффициента отражения неполяризованного света проводились при угле падения $\theta_0 = 59^\circ$. При расчетах дисперсии ошибок при напылении в толщинах и показателях преломления слоев



принимались равными 3%, что соответствует (может быть, с некоторым занижением) напылительной установке ВУ-1А, на которой был изготовлен экспериментальный образец. На рис. 1 представлен расчетный спектр отражения неполяризованного света с коридором дисперсии, крестиками нанесены результаты измерений. Видно, что все экспериментальные данные лежат в коридоре дисперсии коэффициента отражения.

В качестве примера использования данного подхода рассмотрим ожидаемое влияние ощибок на спектральные характеристики разных типов покрытий. При расчетах дисперсии ощибок в толщинах слоев составляли 3%, а в показателях преломления — 1%. На рис. 2, 3 пред-

ставлены расчетные спектральные характеристики $\Phi(k)$ и их математические ожидания $\Phi(k) + M(k)$ с отложенныма относительно последних и заштрихованными коридорами дисперсий D(k). Величина и положение этого коридора и служат характеристикой возможного отклонения реальной характеристики от расчетной. Во всех случаях слои отсчитываются от воздуха.



Рис. 2

На рис. 2, а представлен коэффициент пропускания неполяризованного света T(k) (1) и его математическое ожидание (2) с коридором дисперсин для 6-слойного просветляющего покрытия при $\theta = 45^{\circ}$. Расчетные параметры покрытия имеют следующие значения: показатели преломления нечетных слоев — 1,38; четных слоев — 2,30; подложки — 1,52. Толщины слоев — 0,0933; 0,0086; 0,0225; 0,1293; 0,0349; 0,0175 мкм. Заметим, что у просветляющего покрытия коэффициент отражения *s*-компоненты в несколько раз более чувствителен к ошибкам в параметрах, чем коэффициент отражения *p*-компоненты поля.

На рис. 2, б изображен коэффициент отражения неполяризованного света R(k)(1) с его математическим ожиданием (2) с коридором дисперсии для 5-слойного 50%-го светоделителя при угле падения 45°. Показатели преломления нечетных: сло«ев — 2,30; четных — 1,38; подложки — 1,52. Толщины слоев — 0,00619; 0,1131; 0,0738; 40,0202; 0,0280 мкм. У светоделителя чувствительность s- и p-компонент поля к ошибкам параметров приблизительно одинакова.

Для обеих рассмотренных систем средние отклонения спектральных характеристик имеют близкие значения, в то же время дисперсия, которая характеризует разобрес значений реальной спектральной характеристики, у светоделителя почти на порядок больше, чем у просветляющего покрытия.





Рис. 3

В качестве еще одного примера рассмотрим 31-слойное зеркало с постоянной тразностью фаз 180° между s- и p-компонентами отраженного поля при угле падения 45°. Показатели преломления нечетных слоев — 2,30; четных слоев — 1,40; подложки — 1,52. Толщины слоев зеркала, отличные от четвертьволновых, приведены в четвертьволновых долях в таблице (центральная длина волны $\lambda_0 = 0,5$ мкм). На рис. 3, а

Номер слоя	1	2	3	4	1	5	6	7
Толщина слоя в чет- вертьволновых долях	0, 101	0,800	1,106	6 0,7	702 0	0,604	0,901	1,106
							Прос	олжение
Номер слоя	8	9	10	11	12	13	14	15
Толщина слоя в чет- вертьволновых долях	0,102	0,106	0,102	0,106	0, 101	0,106	1,001	1,002

представлены коэффициенты отражения волн s-поляризации (1), p-поляризации (3) с их математическими ожиданиями (2 и 4 соответственно) и коридорами дисперсий для этого зеркала. При этом p-компонента оказывается в 20—80 раз более чувствительной к ошибкам в параметрах системы, чем s-компонента поля. На рис. 3, 6 изображена разность фаз $\varphi^s - \varphi^p$ Между s- и p-компонентами отраженного поля (1) и ее математическое ожидание (2). Вблизи центральной длины волны, $\lambda_0=0.5$ мкм, воздействие ошибок на разность фаз возрастает. Анализ производных фаз показывает, что это связано с возрастанием влияния ошибок в слоях с номерами от 16 до 24 Дисперсия разности фаз на всем интервале составляет 10—15°. Как и во всех системах, спектральная характеристика более чувствительна к ошибкам в коротковолновой области спектра.

Статистический подход позволяет оценивать чувствительность спектральных характеристик различных многослойных систем к ошибкам в параметрах слоев при наклонном падении света и может использоваться для выбора оптимальных систем «с учетом ошибок в параметрах.

В заключение выражаем нашу глубокую признательность Г. В. Пантелееву за предоставленные экспериментальные данные.

87

[1] Гришина Н. В., Тихонравов А. В.//Опт. и спектр. 1985. 58, № 1. С. 192.

Поступила в редакцию 25.04.88

(2)

 $(3)^{\circ}$

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 3, ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ. 1989. Т. 30, № 1

АКУСТИКА И МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА

УДК 547.962:538.955

ВРАЩАТЕЛЬНОЕ ТРЕНИЕ БИОПОЛИМЕРОВ В РАСТВОРЕ

В. П. Денисов, В. В. Мигулин, Ю. М. Петрусевич, О. П. Ревокатов

(кафедра физики низких температур)

Экспериментально обнаружено сильное влияние электростатических взаимодействий белок — вода на вязкость растворов биополимеров и время корреляции вращательного движения макромолекул. Исследована связь между этими параметрами.

Введение. Исследование динамики макромолекул биополимеров в раствореимеет большое значение для определения механизмов их взаимодействия с растворителем [11]. Такое взаимодействие во многом определяет кинетические характеристики растворов макромолекул. В связи с этим представляет интерес изучение влияния свойств биополимеров, определяющих степень их взаимодействия со средой, наих молекулярную подвижность.

Важным свойством биополимеров в водных растворах является наличие у них большого электряческого заряда, энергия взаимодействия которого с дипольным моментом молекул воды может превышать тепловую. Это взаимодействие можно изучать, измеряя зависимость вязкости раствора и времен ЯМР-релаксации макромолекул при различных концентрациях ионов водорода (рН) в растворе, что позволяет определять связь макроскопических и молекулярных параметров между собой, а также их зависимость от заряда белка.

а также их зависимость от заряда белка. Методика эксперимента. В работе измерялись времена спин-решеточной T_1 и спин-спиновой T_2 ЯМР-релаксации протонов белков в растворе D₂O неселективным методом. Релаксационная кривая протонов белка, измеренная таким способом, состоит из трех компонент с интенсивностями 40%, 30 и 30%, которые соответствуют вкладам от протонов CH₂-, CH- и CH₃-групп белка. Известно [1, 2], что время релаксации большинства этих протонов (по крайней мере CH₂- и CH-групп) определяется вращением макромолекулы как целого.

Для связи времен релаксации с временем вращательной корреляции макромолекул т в данном случае можно взять соотношения Соломона—Бломбергена [3], в которых величина второго момента усреднена по всем протонам белка. При этом отношение T_1/T_2 зависит только от $x = (\omega \tau)^2$, где ω — частота ЯМР, и равно

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{12\,x^2 + 37\,x + 10}{2\,(8\,x + 5)}.$$
(1)

В области $\omega \tau > 1$. уравнение (1) позволяет однозначно определять τ по экспериментально измеренным T_1 и T_2 .

Скорость переориентации белковой макромолекулы в растворе определяется внутренним трением, которое она испытывает при вращении в вязкой среде. При: этом время вращательной корреляции связано с коэффициентом вращательного трения ζ соотношением Дебая—Эйнштейна

$$\tau = \zeta/(6 \kappa T)$$
.

В свою очередь величина ζ определяет увеличение макроскопической вязкости: растворов η по отношению к вязкости чистой воды η₀ [4]:

 $\eta = \eta_0 + \zeta v N_A c / (6 M),$

где v — коэффициент, учитывающий форму макромолекулы, N_A — число Авогадро_г.

88